

# К ТЕОРИИ ЭФФЕКТА ХОЛЛА В СЕТКЕ ИНВЕРСИОННЫХ КАНАЛОВ

Неустроев Л. Н.

В [1] предложена модель фоточувствительной поликристаллической пленки PbS. В этой модели предполагается, что на поверхности кристаллитов *n*-типа проводимости имеются акцепторные состояния, которые захватывают электроны из объема кристаллитов. В результате у поверхности кристаллитов возникают инверсионные каналы *p*-типа. Считается, что перенос фототока осуществляется фотодырками, движущимися по инверсионным каналам вдоль поверхности кристаллитов. Проведенные в [2, 3] детальные эксперименты показали, что модель [1] и развитая на ее основе теория [4] позволяют количественно описать практически все особенности фотоэлектрических процессов, протекающих в поликристаллических пленках PbS. В работах [5-7] модель [1] использована для расчета эффекта Холла, причем результаты, полученные в [7], отличаются от результатов, полученных в [5, 6]. В настоящем сообщении выполнен более детальный, чем в [5-7], анализ эффекта Холла в поликристаллических пленках типа PbS и выяснены причины, приведшие к различию результатов указанных работ.

На рис. 1 схематически изображен фрагмент поликристаллической пленки и стрелкой указано направление протекания тока. Фрагмент разбит на четыре области. Область 1 имеет *n*-тип проводимости, а области 2-4 соответствуют инверсионным каналам на поверхности кристаллитов и имеют *p*-тип проводимости. Формула для холловского напряжения *V*, генерируемого фрагментом пленки, может быть выведена с помощью эквивалентной схемы (рис. 2) и имеет вид

$$\frac{V}{r} = \left( \frac{V_{1n}}{r_n^\perp} + \frac{V_{1p}}{r_p^\perp} \right) + \left( \frac{V_{2n}}{r_n^\parallel} + \frac{V_{2p}}{r_p^\parallel} \right) + \left( \frac{V_{3n}}{r_n^\parallel} + \frac{V_{3p}}{r_p^\parallel} \right) + \frac{V_{4p}}{r_p^\parallel}, \quad (1)$$

где  $V_{in}$  и  $V_{ip}$  — холловские напряжения, генерируемые электронами и дырками в *i*-й области фрагмента;  $r_n^\perp$  и  $r_p^\perp$  ( $r_n^\parallel$  и  $r_p^\parallel$ ) — поперечные (продольные) сопротивления областей 2 и 3 для электронного и дырочного холловских токов соответственно;  $r = r^\perp r^\parallel / (r^\perp + r^\parallel)$ ,  $r^\perp = r_n^\perp r_p^\perp / (r_n^\perp + r_p^\perp)$ ,  $r^\parallel = r_n^\parallel r_p^\parallel / (r_n^\parallel + r_p^\parallel)$ . В эквивалентной схеме и в формуле (1) исходно отброшен холловский ток электронов, генерируемый в области 4. Это связано с тем, что поверхностный изгиб зон в области 4 больше поверхностного изгиба зон в областях 2 и 3 [8]. В результате электронный ток, текущий через область 2, обтекает область 4 по периферии, и холловский ток электронов, генерируемый в области 4, пренебрежимо мал.

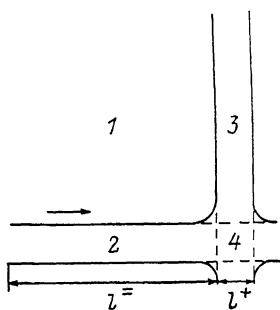


Рис. 1.

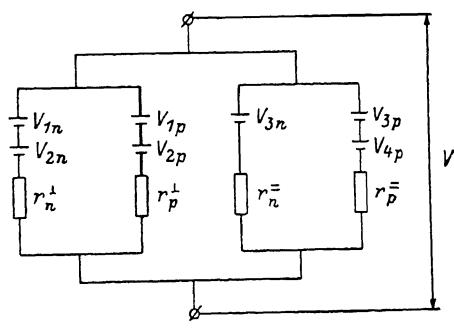


Рис. 2.

Различие результатов работ [5, 6] и [7] является следствием того, что в [5, 6] при расчете  $\bar{V}$  дырочные холловские токи, генерируемые в областях 1-3 [слагаемые  $V_{1p}/r_p^\perp$ ,  $V_{2p}/r_p^\perp$  и  $V_{3p}/r_p^\parallel$  в (1)], считались пренебрежимо малыми по сравне-

нию с электронными холловскими токами, а в работе [7], наоборот, не учитывались электронные холловские токи, генерируемые в областях 2 и 3 [слагаемые  $V_{2n}/r_n^\perp$  и  $V_{2p}/r_p^\perp$  в (1)]. Сравним величины электронного и дырочного холловских токов, генерируемых, например, в области 2. Электроны и дырки двигаются вдоль этой области под действием одинакового тянувшего электрического поля. Поскольку подвижности электронов  $\mu_n$  и дырок  $\mu_p$  в PbS примерно равны, примерно равны и скорости их дрейфа вдоль области 2. Соответственно равны силы Лоренца, действующие в области 2 на электроны и дырки. Следовательно, генерируемый в области 2 холловский ток будет обусловлен носителями того знака, которые имеют большую концентрацию на эффективном уровне протекания соответствующего им холловского тока. Концентрация электронов на уровне протекания электронного холловского тока в области 2 равна концентрации электронов на поверхности кристаллитов  $n_S^-$ , а концентрация дырок на уровне протекания дырочного холловского тока равна концентрации дырок в объеме кристаллитов  $p_v$ . Поскольку в PbS всегда  $n_S^- \gg p_v$ , то  $V_{2n}/r_n^\perp \gg V_{2p}/r_p^\perp$  и постоянная Холла области 2 имеет отрицательный знак, что соответствует результатам работы [6] и не согласуется с результатами работы [7]. Аналогично можно показать, что  $V_{1n}/r_n^\perp \gg V_{1p}/r_p^\perp$  и  $V_{3n}/r_n^\perp \gg V_{3p}/r_p^\perp$ . С учетом этих неравенств эквивалентная схема, приведенная на рис. 2, переходит в упрощенную эквивалентную схему, использованную ранее в [5].

Для величин  $V_{1n}$ ,  $V_{2n}$ ,  $V_{3n}$  и  $V_{4p}$  не трудно получить следующие выражения:

$$V_{1n} = -\frac{j_n^\perp l^+ B}{qn_v}, \quad V_{2n} = -\frac{\mu_n j_n^\perp l^+ B}{q\mu_p p_S^-}, \quad V_{3n} = -\frac{j_p^\perp \mu_p j_n^\perp l^2 B}{qp_S^-}, \quad V_{4p} = \frac{j_p^\perp l^+ B}{qp_S^+}, \quad (2)$$

где  $q$  — заряд электронов,  $l^+$  и  $l^\perp$  — длина и ширина инверсионных каналов,  $j_n^\perp$  и  $j_p^\perp$  — плотность электронного тока, текущего поперек инверсионных каналов, и плотность дырочного тока, текущего вдоль инверсионных каналов,  $p_S^-$  и  $p_S^+$  — концентрации дырок на поверхности кристаллитов в областях 2 (или 3) и 4 соответственно,  $n_v$  — концентрация электронов в нейтральном объеме кристаллитов,  $B$  — магнитная индукция. Подставляя (2) в (1), после несложных преобразований для эффективной постоянной Холла рассматриваемого фрагмента пленки получим формулу

$$R_H = -\frac{1}{qn_v} \left( \frac{r_p^\perp}{r_p^\perp + r_n^\perp} \right)^2 - \frac{2u_n}{q\mu_p p_S^-} \frac{r_p^\perp r_n^\perp}{(r_p^\perp + r_n^\perp)^2} + \frac{1}{qp_S^+} \left( \frac{r_n^\perp}{r_p^\perp + r_n^\perp} \right)^2, \quad (3)$$

которая ранее была приведена в [8] без вывода.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Неустроев Л. Н., Осипов В. В. — ФТП, 1984, т. 18, в. 2, с. 359—362.
- [2] Неустроев Л. Н., Онаркулов К. Э., Осипов В. В. — Микроэлектрон., 1986, т. 15, в. 3, с. 244—254.
- [3] Неустроев Л. Н., Онаркулов К. Э., Осипов В. В. — ФТП, 1987, т. 21, в. 6, с. 989—995.
- [4] Неустроев Л. Н., Осипов В. В. — ФТП, 1986, т. 20, в. 1, с. 66—72.
- [5] Атакулов Ш. Б., Неустроев Л. Н., Осипов В. В. — ФТП, 1984, т. 18, в. 12, с. 2235—2237.
- [6] Неустроев Л. Н., Осипов В. В. — ФТП, 1986, т. 20, в. 1, с. 59—65.
- [7] Атакулов Ш. Б. — ФТП, 1987, т. 21, в. 3, с. 415—419.
- [8] Atakulow Sh. B. — Sol. St. Commun., 1984, v. 51, N 6, p. 415—419.

Получено 19.10.1987

Принято к печати 25.11.1987